# <u>Optická emisní spektrometrie</u> laserem buzeného plazmatu - LIBS

#### Laser Induced Breakdown Spectrometry

#### **LIPS - Laser Induced Plasma Spectrometry**

### (LAS – laser ablation spectrometry) (LSS – laser spark spectrometry)

### Základní princip:

 -interakce vzorku s laserovým paprskem o vysoké hustotě záření (~ 0.1 – 10 GWcm<sup>-2</sup> - laserová ablace), pulzní lasery

-prudký ohřev povrchu vzorku, odpaření uvolnění materiálu ve formě aerosolu a par

-vznik mikroplazmatu, emise elektromagnetického záření

- detekce záření (spektrometrie s časovým rozlišením)

#### <u>Interakce laserový paprsek – pevný vzorek</u>



#### Nejčastěji používané typy pulzních laserů:

Pevnolátkové:

nanosekundové pulzy Nd:YAG - 1064 nm základní vlnová délka - 532 nm druhá harmonická frekvence - 266 nm čtvrtá harmonická frekvence

Ti-safírový – femtosekundové pulzy

Excimerové: 193 nm ArF 248 nm KrF 308 nm XeCI

#### Vliv délky pulsu

při kratších pulsech snižování tavení a napařování materiálu, minimalizace frakcionace selektivním vypařováním z taveniny
 menší energie mikroplazmatu – snižování atomizace materiálu ablatovaného ze vzorku



K. Niemax, Laser ablation – reflection on a very complex technique for solid sampling, Fresenius J. Anal. Chem. (2001) 370:332-340)

### <u>Uspořádání s polopropustným zrcadlem</u> (zrcadlem s otvorem)



6

Laser



Vzorek

### <u>Uspořádání s optickými vlákny</u>

#### přenosná mobilní zařízení – in-situ monitoring



#### Field-Portable LIBS Analyzer

#### Limity detekce (kovy v půdě)

Be 10 ppm Ba 320 ppm Pb 156 ppm Cr 85 ppm



#### Detektor min





pro

### Detekce s využitím optického vlákna



### Detekce s využitím optického vlákna



# Aplikace

průmyslové aplikace – řízení výrobních procesů, kontrola a recyklace surovin, kontrola odpadů a exhalací, kontrola a testy výrobků

aplikace v analýze životního prostředí – monitoring toxických prvků, půdy, ovzduší, anorganický a organický materiál

> aplikace v bezpečnostních službách (detekce výbušnin a toxických látek)

- farmaceutický průmysl a medicína
- soudní analýzy (zuby, kosti)
- ≻ geologie
- > analýza archeologických nálezů a uměleckých předmětů
- kosmický výzkum

vplatnění při vývoji nových materiálů (strojírenství, elektrotechnika, letecký průmysl)

# Způsoby použití

- > identifikace materiálů (sledovaní vybraných části spektra, "fingerprint")
- > on-line sledování obsahu jednoho nebo několika prvků (monitoring)
- stanovení průměrného složení bulk analýza
- Iokální analýzy mikroanalýza (analýza nehomogenit, nanotechnologie)
- mapování povrchů 2 D mapy prvkového rozložení
- stanovení hloubkového profilu vrstevnaté struktury a materiály
- stanovení prostorového rozložení prvků ve vzorku kombinace mapování povrchů a hloubkového profilu 3 D mapy
- použití v "nedestruktivním" modu (minimální průměr kráteru, single pulse techniky)
- dálková měření

### Identifikace materiálů

- identifikace materiálů při třídění odpadů rozlišení kovových materiálů, plasty, papír, dřevo
- identifikace výbušnin (i na dálku) poměr čar N, O, C
- > identifikace archeologických objektů (pod vodou) dřevo, kovy, mramor ...
- databáze čar prvků, případně molekulových pásů
  programy pro "učení" (doplňování knihoven během použití), regresní analýza dat, extrapolace a shluková analýza
- rychlé on line vyhodnocení signálu (spojení s třídícími stroji, případně s přenosnými zařízeními)
- není nutno upravovat povrch vzorku první pulsy laseru čistící, teprve další se použijí pro měření

# Identifikace materiálů

#### identifikace materiálů v bazénech pro vyhořelé palivové články



hliník

hliníkový disk ø 75 mm analyzovaný pod vodou







grafit



nerezová ocel







uran

# Monitorování procesů

- monitorování při řezání, vrtání a svařování laserem (kontrola kvality materiálu, kontrola sváru)
- zamezení záměny materiálu
- odhalení nehomogenit
- kontrola ochranné atmosféry
- sledování parametrů svařování
- tlakové nádoby, součásti reaktorů, letecký a kosmický průmysl
- kombinace s dalšími metodami (rentgen)
- > kontrola struktury materiálů při zátěžových zkouškách
- změny při teplotním a mechanickém namáhaní
- změna signálu při změně krystalové struktury
- vliv korozního prostředí na povrchové vlastnosti

změny chemického složení maziv vlivem otěru součástí
 změny vlastností kapalných medií při poškození potrubí nebo reakčních nádob



# Monitorování procesů

- monitorování při tavení materiálů
- tavení kovů, skel (vitrifikace radioaktivních materiálů), keramických materiálů
- výhody: bezkontaktní měření, měření na dálku, výsledky v reálném čase
  možnost využití jako zpětné vazby
- v hutním průmyslu sledování průběhu taveb (ocel, barevné kovy …)
- analýza strusek
- analýza vstupních surovin
- > analýza konečného produktu (přímo v peci nebo na výstupu z pece bez nutnosti odběru a úpravy vzorků)
- > analýza vrstev (pozinkované plechy, ochranné povlaky, povrchové úpravy)

možnost monitorování výroby mikrosoučástek v elektrotechnice (kontroly vrstevnatých struktur, pokovení kontaktů …)

analýza práškových materiálů přímo na pásech, kapalin a plynů přímo v potrubí

# Stanovení průměrného složení "bulk analysis"

- > není třeba zařízení pro přesné zaměření laserového paprsku
- > použití rozostřeného paprsku pro zachycení větší plochy vzorku
- kvalitativní a kvantitativní analýza
  - kvalitativní analýza knihovny spekter viz. identifikace materiálů
  - kvantitativní analýza problematika kalibrace, spektrálních a nespektrálních interferencí
  - výběr vhodných analytických čar vhodné energie laseru a zaostření výběr ochranné atmosféry (snížení meze detekce, odstranění interferencí) výběr vhodného časového režimu měření (zpoždění, délka vzorkovacího okna) výběr vhodných standardů vyhodnocení signálu (korekce pozadí, meziprvkové korekce) v závislosti na požadavky přesnosti a správnosti výsledků

#### výběr vhodných analytických čar

- v prvním přiblížení lze vycházet z tabulek pro jiskrovou kvantometrii (tabulky pro LIBS zatím nejsou dostupné, částečně mohou být součástí komerčně dodávaných přístrojů, zpravidla pro konkrétní metodiku)
- využití odborných článků (popsána široká škála aplikací)
- výběr čar s ohledem na možnosti spektrometru (při sledování více prvků výběr čar v jednom spektrálním okně pokud je to možné)

 užitečný je výběr čáry porovnávacího prvku (jehož signál je dostatečně silný, jeho obsah se ve vzorku nemění, nebo jen v malém rozsahu, čára má podobné vlastnosti jako u sledovaných prvků a je poblíž ve spektru) možnost korekce fluktuací excitačních podmínek

 výběr čáry s ohledem na množství prvku ve vzorku (rezonanční čáry jen pro stopové prvky – náchylnost k samoabsorpci)

 vhodnost čar je dána typem vzorku a podmínkami měření, nelze zobecňovat

#### výběr vhodné energie laseru, zaostření a atmosféry

-energie a zaostření ve vzájemném vztahu, rozhoduje především hustota zářivého výkonu (~ GW/cm<sup>2</sup>)

- prahová hodnota vznik mikroplazmatu průraz atmosféry
- nízké hodnoty mikroplazma v menším prostoru, menší množství fotonů nižší citlivost (v některých případech vyhovující), menší narušení vzorku
- chladnější mikroplazma větší interference, často větší rozsah linearity kalibračních křivek u majoritních prvků
- u vyšších hodnot hustoty zářivého výkonu zvýšení citlivosti, zvýšení pozadí, rozšíření čar (lze odstranit vhodným načasováním), vznik samoabsorbce
- stínění mikroplazmatem u laserů IR, VIS (plasma shielding) naopak snížení citlivosti u vyšších energií laseru
- negativní vliv na průběh kalibračních křivek, tvar kráterů, narušení méně pevných vzorků (tablety, vrstevnaté materiály, polymery ....) drolení, praskání ..
- možnost zaostření ovlivněna vlnovou délkou laseru
- pro kratší vlnové délky použití nižší energie, zaostření na menší plochu

Výběr atmosféry:

u bulk analýzy především z důvodu vyšší citlivosti (Ar, He)

argon – větší mikroplazma trvající delší dobu

helium – pozitivní vliv na tvar kráterů

vzduch – nejjednodušší instrumentace

#### výběr vhodného časového režimu

- zpoždění a integrační doba – s ohledem na dobu přechodu

-vysoké pozadí rozšíření čáry na začátku

- vyhasínání na konci (zvýšení šumu)

 liší se čára od čáry (iontové vyhasínají dříve než atomové, některé čáry registrovatelné i několik desítek mikrosekund

- lze využít pro snížení spektrálních interferencí
- zpravidla kompromisní podmínky pro více čar

#### výběr vhodných standardů

- co nejpodobnější charakter se vzorkem
- rozsah obsahů sledovaných prvků pokud možno v dostatečně širokém rozmezí
- homogenní
- měly by projít stejnou úpravou jako vzorek
- komerční dostupnost omezená (kovy, skla, půdy, sedimenty, strusky, popílky ..)
- příprava ze sady vzorků o známém složení (analýza jinou technikou)
- standardní přídavky (práškové materiály, taveniny ...)
- rozsah použití daný typem vzorku (matrix efekty např. různé kalibrace pro různé typy půd, skel apod.)

#### vyhodnocení signálu

 korekce pozadí – odečet vedle čáry (jednobodvá, dvoubodová) problém u spektrometrů s nižším rozlišením a u složitých spekter

- bez korekce pozadí (posun kalibrační křivky na ose y, při neměnném pozadí)
- s použitím porovnávacího prvku

-sestrojení kalibračních křivek (často i nelineárních)
 -použití různých čar pro různé rozsahy obsahů
 -meziprvkové korekce

-použití bezkalibračních technik

#### Koncentrace ekvivalentní pozadí a mez detekce



Nulová linie

<sup>‡</sup> RSD<sub>L</sub>

 $I_L S = I_L/c_A$ 

t RSD<sub>B</sub>

B (= I<sub>B</sub>)



Průběh signálu 50 ns až 5 μs po pulsu laseru v maximu čáry Cr I - 520,84 nm na pozadí při 520,50 nm (I<sub>b</sub>) a rozdíl signálů v maximu a na pozadí (I<sub>max</sub>.- I<sub>b</sub>). Měření vzorku 558 (27,98 % Cr), průměrný signál po 128 pulsech laseru.

Cr(l) 520,842 nm



24

Rozdíl signálů v maximu čáry Mn 404,135 nm a na pozadí 404,215nm (I<sub>max</sub>.- I<sub>b</sub>). Měření vzorku 522 (0,42%), průměrný signál po 128 pulsech laseru.

Mn 404,135 nm



#### <u>Kalibrační křivka pro Si</u>

Si(I) 288,158 nm odečet pozadí 288,358nm (I<sub>max</sub>.- I<sub>b</sub>). průměrování 128 pulsů laseru 3 měření v různých místech vzorku

#### Si 288,158 nm



#### Odhad mezí detekce (LOD): trojnásobek směrodatné odchylky pozadí

prvek	LOD (%)					
čára (nm)	1µs	2 µs	3 µs	4 µs	5 µs	
Cr 520,842	0,058	0,027	0,034	0,023	0,023	
Mn 404,135	0,092	0,043	0,054	0,035	0,042	
Si 288,158	0,037	0,039	0,027	0,020	0,025	
Mo 553,303	0,025	0,015	0,019	0,020	0,025	
Ni 352,454	0,049	0,024	0,025	0,024	0,028	

- není třeba složitá úprava vzorků ani ochranná atmosféra
- měření bez kontaktu se vzorkem
- možná další optimalizace a zlepšení parametrů systému

# Příprava vzorků – práškové tablety s pojivem (stříbro)

 Mletí a homogenizace v kulovém mlýně FRITSCH Pulverissette 7 (10 minut, 420 otáček/min), lisování do tablet na ručním hydraulickém lisu Mobiko SP2, lisovací čas 30 s, tlak 7,5 MPa

 Lisování směsi práškových karbidů s práškovým stříbrem v hmotnostním poměru 1:1

# Příprava vzorků – kompaktní karbidy wolframu

- Zalití do kruhové polymetakrylátové formy o průměru 3,5 cm a tloušťce 7 mm.
- Následně zabroušení a vyleštění povrchu vzorků



### Popis vzorků – kompaktní karbidy wolframu

Obsah niobu: 0,02 – 3,21 % (m/m)

Obsah titanu: 0,02 – 14,9 % (m/m)

Obsah tantalu: 0,05 – 8,10 % (m/m)

Obsah kobaltu: 3,67 – 12,90 % (m/m)

# Použité vlnové délky

Prvek	Vlnová délka (nm)	Energie (eV)	
Nb (I)	358,02	3,5950	
Nb (I)	405,89	3,1865	
Nb (I)	407,97	3,1268	
Ta (I)	648,53	3,5694	
<b>Co (I)</b>	350,25	6,7355	
Ti (I)	361,03	4,5004	
Ti (I)	498,19	4,9188	
Ti (I)	597,85	3,9495	

#### Srovnání experimentálních uspořádání, tablety bez pojiva



### Srovnání výsledků práškové karbidy wolframu niob Nb(I) 405,89 nm



# Lokální analýza – mikroanalýza

- > zařízení pro přesné zaměření laserového paprsku
- > sledování tvaru kráterů a průběhu ablace CCD kamerou



 s použitím vhodné optiky velikost kráterů i pod 1 µm (pod 100 µm běžně)

geologické materiálynanotechnologiebiologické materiály

- > zařízení pro přesné zaměření laserového paprsku
- > sledování tvaru kráterů a průběhu ablace CCD kamerou
- automatizovaný posun vzorku rastry



Mapování povrchu hliníkové slitiny





266 nm, 8 µJ

I.V. Cravetchi et al. / Spectrochimica Acta Part B 59 (2004) 1439–1450



identifikovány 2 druhy precipitátů: Al–Cu–Fe–Mn Al–Cu–Mg

problém redepozice materiálu kolem kráterů



I.V. Cravetchi et al. / Spectrochimica Acta Part B 59 (2004) 1439–1450



Micro-laser-induced breakdown spectroscopy technique: a powerful method for performing quantitative surface mapping on conductive and nonconductive samples

Denis Menut, Pascal Fichet, Jean-Luc Lacour, Annie Rivoallan, and Patrick Mauchien 20 October 2003 Vol. 42, No. 30 APPLIED OPTICS





Fig. 3. Resolution of micro LIBS measured on a steel sample during a mapping test. The surface profile was obtained with the use of a light-phase microscopic interferometer.



Fig. 4. Analytical resolution of a laser probe. At least four laser shots are required for the best concentration.



Mapping of a ceramic pellet surface with 3-µm spatial Fig. 5. resolution before and after heating of the pellet.



Denis Menut, Pascal Fichet, Jean-Luc Lacour, Annie Rivoallan, and Patrick Mauchien 20 October 2003 Vol. 42, No. 30 APPLIED OPTICS

stanovení nehomogenit v keramických materiálech

stanovení nehomogenit v kovech

prostorové rozložení prvků v geologických materiálech, půdách, popílcích





Denis Menut, Pascal Fichet, Jean-Luc Lacour, Annie Rivoallan, and Patrick Mauchien 20 October 2003 Vol. 42, No. 30 APPLIED OPTICS



Fig. 8. Catch of alluvial soil along the Garonne River bed (top) and of a volcanic ash sample (bottom). Surface distribution of multiple elements with 3-μm (top) and 10-μm (bottom) spatial resolution. We deduced the composition of micro areas by using micro LIBS to image the results.

Denis Menut, Pascal Fichet, Jean-Luc Lacour, Annie Rivoallan, and Patrick Mauchien 20 October 2003 Vol. 42, No. 30 APPLIED OPTICS

# Stanovení hloubkového profilu

výhody jednoduchost, cena, minimální příprava vzorku, využití pro různé druhy vzorků, atmosférický tlak (další metody - GD-OES, LA-ICP-OES/MS, SIMS, EPXMA)

vliv vlastností laserového paprsku na tvar kráteru a hloubkové rozlišení (vlnová délka, profil paprsku délka pulzu)

široký rozsah - tloušťky vrstev (desítky nm až stovky µm)

#### Hloubkový profil



Průměrná ablační rychlost (AAR)

[nm/pulz]

AAR = počet pulzů (x)

Hloubkové rozlišení (DR) [µm]

DR = AAR\*10<sup>-3</sup> \* počet pulzů (dr)

#### Vzorky

Vzorok	Tloušťka Zn	Obsah Zn
V ZUI EK	vrstvy [µm]	[g.cm <sup>-2</sup> ]
Galfan	6	59
Galvanneal	9	59,1
<b>Electroplated Zn</b>	10	71,1
Hot dipped Zn	20	131,3
Aluzink	24	36,9





Electroplated Zn – Sollac, Zn (I) 280,08 nm, Fe (I) 344,06 nm, 100 mJ/pulz, vzduch -20 mm, 5 μs.



Electroplated Zn – Sollac, Zn (I) 280,08 nm, Fe (I) 344,06 nm, 100 mJ/pulz, argon -15 mm, 5 μs.



Electroplated Zn – Sollac, Zn (I) 280,08 nm, Fe (I) 344,06 nm, 100 mJ/pulz, helium -20 mm, 5 μs.

#### **Krátery**



Electroplated Zn – Sollac, Zn (I) 280,08 nm, Fe (I) 344,06 nm, 100 mJ/pulz, He -20 mm, Ar -15 mm, vzduch -20 mm.

Vzduch

Argon

Helium

3D profily ablačních kráterů po dopadu 200 laserových pulzů o energii 100 mJ





#### Hloubkový profil



Zn (I) 280,08 nm, Fe (I) 344,06 nm, 100 mJ/pulz, He -20 mm, 10 μs.





### lloubkové rozlišení

DR = AAR \* dr

Helium (100 mJ/pulz)

	Tloušťka vrstvy	DR Fe [µm]		DR Zn [µm]	
Vzorek	Zn [µm]	5	10	5	10
Galfan	6	2	2	28	9
Galvanneal	9	~	~	23	15
Electroplated Zn	10	4	3	19	5
Hot Dipped Zn	20	12	7	25	13
Aluzink	24	15	10	28	14

### Stanovení prostorového rozložení prvků ve vzorcích 3 D mapování

> kombinace mapování povrchu a stanovení hloubkového profilu

vliv vlastností laserového paprsku na tvar kráteru, hloubkové a prostorové rozlišení (vlnová délka, profil paprsku délka pulzu)

> aplikace na vrstevnaté materiály (keramické dlaždice)

> zatím nepříliš rozšířená technika (postery na konferencích)

# Analýza uměleckých předmětů

Hellenic Project for Wider Application (Řecko)

#### množství materiálu 20-200 ng hloubka kráteru 1-20 µm průměr kráteru < 100 µm









# Analýza uměleckých předmětů





Melasanaki et al. / Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 56 (2001) 2337-2346

2339

K. Melessanaki et al.Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 56(2001)23372346

# Analýza uměleckých předmětů



Fig. 1. Ceramic sample D29—areas analyzed by LIBS are signed with (G)—glaze, (B)—blue pigment, (L)—golden luster.



Fig. 2. Fragment of Roman sculpture: the areas analyzed by LIBS are shown by arrows.

Table 2		
Description of bronze	samples	analyzed

ample	Description	Dated
inger IN16 IN9 IN40	Fragment of Roman sculpture Coin with head of Marco Aurelio, weight 8 g. Coin with head of Nerone, weight 3.3 g. Coin of 5 centesimal, with head of Vittorio Emmanuele II, weight 4.5 g.	I Century BC AC 140 AC 54 AC 1862

F. Colao et al. / Spectrochimica Acta Part B 57 (2002) 1219–1234

#### zvýšení citlivosti a selektivity metody



Sensitive and selective spectrochemical analysis of metallic samples: the combination of laser-induced breakdown spectroscopy and laser-induced fluorescence spectroscopy: H.H. Telle,, D.C.S. Beddows, G.W. Morris, O. Samek Spectrochimica Acta Part B 56 (2001) 947-960



meze detekce ~ 100 ppm

#### v kovových materiálech

#### Table 1

Experimental parameters for LIFS for elements investigated in this study. Relevant spectral data are included

Element	Probe wavelength (nm)	Observation	τ	Experimental	Pulse energies	
		wavelength (nm)	(ns)	set-up	Probe (mJ)	Ablation (mJ)
Al	394.40 (2 w)	396.15	10	L; F	4	20
Cr	425.40 (2 w)	427.48 428.97	33 31	L; F; M	2	15
Fe	425.08 (2 ω)	432.58 430.79	20 29	L; F; M	4	20
Si	251.61 (3ω)	288.16	5.3	L; F	1	20

Abbreviations: L, laboratory set-up; F, remote fibre set-up; M, remote FTIR modulator set-up. Values for the radiative lifetimes  $\tau$  were obtained from Lide [15].





Analysis of heavy metals in soils using laser-induced breakdown spectrometry combined with laserinduced fluorescence Frank Hilbk-Kortenbruck,, Reinhard Noll, Peter Wintjens, Heinz Falk, Christoph Becker Spectrochimica Acta Part B 56 (2001) 933-945



Frank Hilbk-Kortenbruck,, Reinhard Noll, Peter Wintjens, Heinz Falk, Christoph Becker Spectrochimica Acta Part B 56 (2001) 933-94



Fig. 7. Illustration of the detection limits  $(LOD_{3s})$  demonstrated with LIBS ( $\Box$ ) and LIBS-LIF ( $\blacktriangle$ ) for the analysis of soils at atmospheric pressure in comparison with German regulatory limits for unpolluted soils (Z0, O). The bars depict the range of analyte concentrations covered by the calibration samples.



Frank Hilbk-Kortenbruck,, Reinhard Noll, Peter Wintjens, Heinz Falk, Christoph Becker Spectrochimica Acta Part B 56 (2001) 933-94